

硅棒横截面上五个位置处的电阻率测试实验数据记录表

温度		样品厚度		样品直径		
	测试电流(mA)	正向电压(mV)	反向电压(mV)	电压平均值	电阻率 $\rho_T$	电阻率 $\rho_{23}$
位置1						
位置2						
位置3						
位置4						
位置5						
电阻率平均值				电阻率不均匀度		

硅片电阻率测试实验数据记录表

温度		样品厚度		样品直径		
探针间距S		d/S=	F(d/S)=	S/D=	F(S/D)=	
方法一	直读法	测试电流		直读电阻率		
方法二	测试电流(mA)	正向电压(mV)	反向电压(mV)	电压平均值	电阻率 $\rho_T$	电阻率 $\rho_{23}$
测量1						
测量2						
测量3						
测量4						
测量5						
电阻率平均值						

扩散片方块电阻测试实验数据记录表

温度		样品结深		样品直径	
探针间距S	0.1 cm	d/S=	F(d/S)=	S/D=	F(S/D)=
方法一	直读法	测试电流		直读方块电阻	
方法二	测试电流(mA)	正向电压(mV)	反向电压(mV)	电压平均值	方块电阻
测量1					
测量2					
方块电阻平均值					

FTO 玻璃方块电阻测试实验数据记录表

温度		薄膜厚度	0.185 μm	样品直径	6 cm
探针间距S	0.1 cm	d/S=0	F(d/S)=1	S/D=	F(S/D)=
方法一	直读法	测试电流		直读方块电阻	
方法二	测试电流(mA)	正向电压(mV)	反向电压(mV)	电压平均值	方块电阻
测量1					
测量2					
方块电阻平均值					

ITO 玻璃方块电阻测试实验数据记录表

温度		薄膜厚度	1.2 μm	样品直径	6 cm
探针间距S	0.1 cm	d/S=0	F(d/S)=1	S/D=	F(S/D)=
方法一	直读法	测试电流		直读方块电阻	
方法二	测试电流(mA)	正向电压(mV)	反向电压(mV)	电压平均值	方块电阻
测量1					
测量2					
方块电阻平均值					